

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EP04/52284

**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 11 JAN 2005

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

103 44 410.6

Anmeldetag:

25. September 2003

Anmelder/Inhaber:Leica Microsystems Heidelberg GmbH,
68165 Mannheim/DE**Bezeichnung:**

Rastermikroskop mit evaneszenter Beleuchtung

IPC:

G 02 B 21/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.München, den 18. November 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Stanschus

Rastermikroskop mit evaneszenter Beleuchtung

Die Erfindung betrifft ein Rastermikroskop.

In der Rastermikroskopie wird eine Probe mit einem Lichtstrahl beleuchtet, um
5 das von der Probe emittierte Detektionslicht, als Reflexions- oder
Fluoreszenzlicht, zu beobachten. Der Fokus eines
Beleuchtungslichtstrahlenbündels wird mit Hilfe einer steuerbaren
Strahlablenkeinrichtung, im Allgemeinen durch Verkippen zweier Spiegel, in
einer Probenebene bewegt, wobei die Ablenkachsen meist senkrecht
10 aufeinander stehen, so dass ein Spiegel in x-; der andere in y-Richtung
ablenkt. Die Verkipfung der Spiegel wird beispielsweise mit Hilfe von
Galvanometer-Stellelementen bewerkstelligt. Die Leistung des vom Objekt
kommenden Detektionslichtes wird in Abhängigkeit von der Position des
Abtaststrahles gemessen. Üblicherweise werden die Stellelemente mit
15 Sensoren zur Ermittlung der aktuellen Spiegelstellung ausgerüstet. Speziell in
der konfokalen Rastermikroskopie wird ein Objekt mit dem Fokus eines
Lichtstrahls in drei Dimensionen abgetastet.

Ein konfokales Rastermikroskop umfasst im Allgemeinen eine Lichtquelle,
eine Fokussieroptik, mit der das Licht der Quelle auf eine Lochblende – die
20 sog. Anregungsblende - fokussiert wird, einen Strahlteiler, eine

- Strahlableinrichtung zur Strahlsteuerung, eine Mikroskopoptik, eine Detektionsblende und die Detektoren zum Nachweis des Detektions- bzw. Fluoreszenzlichtes. Das Beleuchtungslicht wird über einen Strahlteiler eingekoppelt. Das vom Objekt kommende Fluoreszenz- oder Reflexionslicht
- 5 gelangt über die Strahlableinrichtung zurück zum Strahlteiler, passiert diesen, um anschließend auf die Detektionsblende fokussiert zu werden, hinter der sich die Detektoren befinden. Diese Detektionsanordnung wird Descan-Anordnung genannt. Detektionslicht, das nicht direkt aus der Fokusregion stammt, nimmt einen anderen Lichtweg und passiert die
- 10 Detektionsblende nicht, so dass man eine Punktinformation erhält, die durch sequentielles Abtasten des Objekts mit dem Fokus des Beleuchtungslichtstrahlenbündels zu einem dreidimensionalen Bild führt. Meist wird ein dreidimensionales Bild durch schichtweise Bilddatennahme erzielt.
- 15 Aus US 2002/0097489 A1 ist ein Mikroskop mit evaneszenter Beleuchtung einer Probe bekannt. Das Mikroskop beinhaltet eine Weißlichtquelle, deren Licht über eine Schlitzblende durch das Mikroskopobjektiv hindurch in den eine Probe tragenden Objektträger zur evaneszenten Beleuchtung eingekoppelt wird. Das Beleuchtungslicht pflanzt sich in dem Objektträger
- 20 durch totalinterne Reflektion fort, wobei die Beleuchtung der Probe nur im Bereich des aus dem Objektträger herausragenden evaneszenten Feldes erfolgt. Mikroskope dieser Art sind unter dem Begriff TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescent Microscope) bekannt.
- Die z-Auflösung von TIRF-Mikroskopen ist aufgrund des nur ca. 100 nm in die
- 25 Probe ragenden evaneszenten Feldes außerordentlich gut.
- Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Rastermikroskop anzugeben, mit dem sowohl die Vorteile einer evaneszenten Beleuchtung als auch die Vorteile der Rastermikroskopie nutzbar sind.
- Die Aufgabe wird durch ein Rastermikroskop mit einer Lichtquelle, die eine auf
- 30 einem Objektträger angeordnete Probe evaneszent beleuchtet, mit einem Punktdetektor, der von einem Rasterpunkt der Probe ausgehendes

Detektionslicht empfängt, und mit einer im Strahlengang des Detektionslichtes angeordneten Strahlableinrichtung zum Verschieben der Position des Rasterpunktes in der Probe, gelöst.

- 5 Die Erfindung hat den Vorteil, dass sowohl eine Abrasterung der Probe in zwei Dimensionen oder in drei Dimensionen, als auch ein stark gesteigertes Auflösungsvermögen in z-Richtung ermöglicht ist.

- 10 Das Abrastern der Probe in lateraler Richtung (xy-Richtung) wird mit Hilfe der im Strahlengang des Detektionslichts angeordneten Strahlableinrichtung bewirkt. Zum Abrastern der Probe in axialer Richtung (z-Richtung) ist der Relativabstand von Probe und Objektiv verstellbar. Hierzu kann entweder die Probe auf einen höhenverstellbaren Tisch angeordnet sein oder ein in z-Richtung verstellbares Objektiv verwendet werden.

- 15 Das Beleuchtungslicht ist vorzugsweise durch das Objektiv des Rastermikroskops in das Deckglas der Probe einkoppelbar. In einer anderen Variante wird das Beleuchtungslicht durch den Kondensor des Rastermikroskops in den Objektträger eingekoppelt. In einer ganz anderen Variante erfolgt die Einkopplung weder durch das Objektiv noch durch den Kondensor sondern direkt, beispielsweise über ein Prisma, in den Objektträger.

- 20 Das Beleuchtungslicht verläuft vorzugsweise durch den Außenrandbereich der Objektivpupille, um zu gewährleisten, dass der kritische Winkel der Totalreflexion im Deckglas erreicht wird. Vorzugsweise ist das Beleuchtungslicht zu einem Beleuchtungslichtstrahlenbündel geformt, das vorzugsweise in der Ebene der Objektivpupille einen Fokus aufweist. Das
25 Beleuchtungslichtstrahlenbündel kann während der Untersuchung einer Probe ortsfest bleiben. In einer besonders bevorzugten Variante ist das Beleuchtungslichtstrahlenbündel mit Hilfe einer weiteren Strahlableinrichtung kreisend durch den Außenbereich der Objektivpupille beweglich. Hierdurch wird in besonders vorteilhafter Weise eine sehr
30 homogene und gleichmäßige Beleuchtung erreicht.

Das Objektiv weist vorzugsweise eine numerische Apertur auf, die größer als 1,3 ist und besonders vorteilhafterweise zwischen 1,35 und 1,42 liegt.

5 In einer bevorzugten Ausgestaltungsform ist im Strahlengang des Beleuchtungslichtes vorzugsweise in der Ebene der Objektivpupille eine farbselektive Segmentblende angeordnet. Die farbselektive Segmentblende weist im Außenrandbereich andere optische Eigenschaften auf, als im Innenbereich. Vorzugsweise ist die farbselektive Segmentblende im Außenrandbereich für Licht der Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent, während sie im Innenbereich ausschließlich für Licht oberhalb der
10 Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent ist. Diese Ausgestaltungsvariante ist insbesondere für Fluoreszenzanwendungen, bei denen die Wellenlänge des Detektionslichts naturgemäß oberhalb der Wellenlänge des Beleuchtungslichts liegt, besonders zu bevorzugen.

15 In einer anderen Variante ist die farbselektive Segmentblende im Innenbereich ausschließlich für Licht unterhalb der Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent. Diese Variante ist insbesondere zur Mehrphotonenanregung der Probe geeignet. Hierbei ist das Beleuchtungslicht vorzugsweise gepulstes Infrarotlicht.

20 Mit Hilfe der farbselektiven Segmentblende wird vermieden, dass Beleuchtungslicht außerhalb des Außenrandbereiches durch das Objektiv auf die Probe gelangt und die Probe direkt beleuchtet.

25 In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltungsvariante weist das Beleuchtungslicht mehrere Wellenlängen auf. In dieser Variante sind beispielsweise mehrere unterschiedliche Probenfarbstoffe gleichzeitig optisch anregbar.

Der Punktdetektor beinhaltet vorzugsweise in einer zur Fokalebene des Objektivs korrespondierenden Ebene eine Detektionslochblende. Die räumliche Lage des Rasterpunktes, von dem der Punktdetektor Detektionslicht empfangen kann, ist durch die Position der Detektionslochblende und durch
30 die Stellung der Strahlableitvorrichtung festgelegt.

In einer bevorzugten Variante beinhaltet der Punktdetektor einen Multibanddetektor oder ein Spektrometer. Hierdurch ist es ermöglicht, spektrale Punktinformationen aus der Probe zu erhalten. Insbesondere in Kombination mit einer Mehrfarbbeleuchtung ist diese Ausführungsvariante von besonderem Vorteil.

Das erfindungsgemäße Rastermikroskop kann zusätzlich als konfokales Rastermikroskop ausgebildet sein, wobei gleichzeitig sowohl eine konfokale Untersuchung der Probe durch den Innenbereich der farbselektiven Segmentblende erfolgen kann, während gleichzeitig eine TIRF-Beleuchtung durch den Außenbereich der farbselektiven Segmentblende ermöglicht ist.

Zur Erzeugung des Fokus des Beleuchtungslichtstrahlenbündels in der Ebene der Objektivpupille ist im Strahlengang des Beleuchtungslichts eine Abbildungsoptik, vorzugsweise eine Bertrandlinse vorgesehen.

In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltungsform umfasst der Lichtweg des Detektionslichts mehrere Detektionskanäle, wobei in jedem der Detektionskanäle ein Bandpassfilter vorgesehen sein kann.

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleich wirkende Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:

- Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Rastermikroskop,
- Fig. 2 eine farbselektive Segmentblende,
- Fig. 3 ein weiteres erfindungsgemäßes Rastermikroskop und
- Fig. 4 ein weiteres erfindungsgemäßes Rastermikroskop.

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Rastermikroskop mit einer Lichtquelle 1, die als Argonionenlaser 3 ausgebildet ist. Die Lichtquelle 1 erzeugt ein Beleuchtungslichtstrahlenbündel 5, das von einem Strahlteiler 7 zu dem Objektiv 9 reflektiert wird. Das Beleuchtungslichtstrahlenbündel 5 verläuft durch den Außenrandbereich der Objektivpupille 11 (durch den Doppelpfeil 24 angedeutet) und wird in das Deckglas 13 der Probe 15 zur evaneszenten Beleuchtung eingekoppelt. Im Strahlengang des

Beleuchtungslichtstrahlenbündels 5 befindet sich eine als Bertrandlinse 17 ausgebildete Abbildungsoptik 19, die in der Ebene der Objektivpupille 11 einen Fokus erzeugt. Außerdem befindet sich im Strahlengang des Beleuchtungslichtstrahlenbündels 5 eine weitere Strahlableinrichtung 21, die einen nicht gezeigten kardanisch aufgehängten Scanspiegel beinhaltet. Mit Hilfe der weiteren Strahlableinrichtung wird der Fokus des Beleuchtungslichtstrahlenbündels kontinuierlich kreisend durch den Außenrandbereich der Objektivpupille 11 bewegt, wodurch eine besonders homogene evaneszente Beleuchtung erreicht wird. In der Ebene der Objektivpupille 11 ist die in Fig. 2 gezeigte farbselektive Segmentblende 23 angeordnet. Die farbselektive Segmentblende 23 weist einen Außenrandbereich 25 auf, der für das Beleuchtungslicht transparent ist. Außerdem weist die farbselektive Segmentblende 23 einen Innenbereich 27 auf, der für Licht oberhalb der Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent ist. Das von der Probe ausgehende Detektionslicht 51 gelangt durch das Objektiv und den Innenbereich der farbselektiven Segmentblende zum Strahlteiler 7, passiert diesen und gelangt über die Strahlableinrichtung 29, die einen kardanisch aufgehängten Scanspiegel 31 beinhaltet, zum Punktdetektor 33. Der Punktdetektor 33 beinhaltet eine Detektionslochblende 35, deren räumliche Lage zusammen mit der Stellung des kardanisch aufgehängten Scanspiegels 31 die Position des Rasterpunktes in der Probe bestimmt, von dem der Punktdetektor 33 Detektionslicht 51 empfängt. Der Punktdetektor 33 beinhaltet einen Multibanddetektor 36, der simultan Detektionslicht 51 in mehreren einstellbaren Wellenlängenbändern empfangen kann. Das Beleuchtungslichtstrahlenbündel des Argonionenlasers 3 beinhaltet Beleuchtungslicht mehrerer Wellenlängen, wodurch eine Mehrfarbanregung der Probe ermöglicht ist.

Fig. 3 zeigt ein weiteres erfindungsgemäßes Rastermikroskop, bei dem simultan zur TIRF-Untersuchung einer Probe eine konfokale Untersuchung einer Probe ermöglicht ist. Dieses Rastermikroskop beinhaltet eine weitere Lichtquelle 37, die als gepulster Titan-Saphirlaser 39 ausgebildet ist und die ein weiteres Beleuchtungslichtstrahlenbündel 41 emittiert. Das weitere

Beleuchtungslichtstrahlenbündel 41 gelangt durch einen zweiten Strahlteiler 43 und über die Strahlableinrichtung 29, sowie durch den Strahlteiler 7 und einen dritten Strahlteiler 45 zum Objektiv 9 und beleuchtet durch den Innenbereich 27 der Segmentblende 23 durch die Probe 15 direkt. In der

5 Probe 15 wird unabhängig von der TIRF-Beleuchtung mit dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel 5 durch das weitere Beleuchtungslichtstrahlenbündel 41 eine Zweiphotonenanregung der Probe bewirkt. Das durch die Zweiphotonenanregung der Probe entstehende weitere

10 Detektionslicht 53 wird mit Hilfe eines Non-Descan-Detektors 47, der als CCD-Element 49 ausgebildet ist, detektiert. Dieses weitere Detektionslicht 53 gelangt über den Innenbereich des Objektivs, durch Reflektion am dritten Strahlteiler 45 zu dem Non-Descan-Detektor 47. Bei diesem Rastermikroskop ist in der Objektivpupille eine andere farbselektive Segmentblende eingesetzt, die im Außenrandbereich für das Beleuchtungslichtstrahlenbündel 5 der

15 Lichtquelle 1 transparent ist und die im Innenbereich für dieses Licht reflektierend ausgebildet ist. Hierdurch ist gewährleistet, dass kein Beleuchtungslicht direkt auf die Probe eingestrahlt wird. Die Strahlteiler 7, 45 und 43 sind derart ausgebildet, dass weder das Licht des Beleuchtungslichtstrahlenbündels 5 als auch des Titan-Saphirlasers 39 zu dem Punktdetektor 33 oder zu dem Non-Descan-Detektor 47 gelangt.

20

In Fig. 4 ist eine weitere denkbare Variante des erfindungsgemäßen Rastermikroskops dargestellt. In diesem Fall besteht die Lichtquelle 1 aus einem Titan-Saphirlaser 55, der ein Beleuchtungslichtstrahlenbündel 5 emittiert, das als TIRF-Beleuchtung durch den Außenrandbereich 25 einer farbselektiven Segmentblende 23 geführt wird. Die evaneszente Beleuchtung induziert in der Probe 15 Mehrphotonenanregung. Das daraus entstehende

25 Fluoreszenzlicht gelangt durch die gesamte Segmentblende 23 über den dritten Strahlteiler 45 zum Non-Descan-Detektor 47, der als CCD-Element 49 ausgeführt ist. Direkt im Anschluss daran wird ein dreidimensionales Bild der

30 Probe durch konfokale Beleuchtung mit einer Lichtquelle 37, die aus einem Argonionenlaser 57 besteht, und Detektion mit einem Punktdetektor 33, der als Multibanddetektor 36 ausgebildet ist, aufgenommen.

Die Erfindung wurde in Bezug auf eine besondere Ausführungsform beschrieben. Es ist jedoch selbstverständlich, dass Änderungen und Abwandlungen durchgeführt werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste:

	1	Lichtquelle
	3	Argonionenlaser
5	5	Beleuchtungslichtstrahlenbündel
	7	Strahlteiler
	9	Objektiv
	11	Objektivpupille
	13	Deckglas
10	15	Probe
	17	Bertrandlinse
	19	Abbildungsoptik
	21	Strahlableinrichtung
	23	Segmentblende
15	24	Doppelpfeil
	25	Außenrandbereich
	27	Innenbereich
	29	Strahlableinrichtung
	31	Scanspiegel
20	33	Punktdetektor
	35	Detektionslochblende
	36	Multibanddetektor
	37	Lichtquelle
	39	Titan-Saphirlaser
25	41	Beleuchtungslichtstrahlenbündel
	43	zweiter Strahlteiler
	45	dritter Strahlteiler
	47	Non-Descan-Detektor
	49	CCD-Element
30	51	Detektionslicht
	53	Detektionslicht
	55	Titan-Saphir-Laser
	57	Argonionenlaser


Patentansprüche

1. Rastermikroskop mit einer Lichtquelle, die eine auf einem Objektträger angeordnete Probe evaneszent beleuchtet, mit einem Punktdetektor, der von einem Rasterpunkt der Probe ausgehendes Detektionslicht empfängt, und mit einer im Strahlengang des Detektionslichtes angeordneten Strahlableinrichtung zum Verschieben der Position des Rasterpunktes in der Probe.
5
2. Rastermikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht in den Objektträger oder in das Deckglas der Probe einkoppelbar ist.
10
3. Rastermikroskop nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastermikroskop einen Kondensor aufweist und das Beleuchtungslicht durch den Kondensor in den Objektträger einkoppelbar ist.
4. Rastermikroskop nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastermikroskop ein Objektiv aufweist und das Beleuchtungslicht durch das Objektiv in das Deckglas einkoppelbar ist.
15
5. Rastermikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Objektiv eine Objektivpupille aufweist und dass das Beleuchtungslicht durch den Außen-Randbereich der Objektivpupille verläuft.
6. Rastermikroskop nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht in einem Beleuchtungslichtstrahlenbündel verläuft.
20
7. Rastermikroskop nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Beleuchtungslichtstrahlenbündel in der Ebene der Objektivpupille einen Fokus aufweist.
8. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang des Beleuchtungslichtes eine weitere Strahlableinrichtung vorgesehen ist, mit der die räumliche Lage des Beleuchtungslichtstrahlenbündels veränderbar ist.
25
9. Rastermikroskop nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Strahlableinrichtung das Beleuchtungslichtstrahlenbündel
30

kreisend durch den Außen-Randbereich der Objektivpupille lenkt.

10. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Objektiv eine numerische Apertur größer 1,3, vorzugsweise zwischen 1,35 und 1,42, aufweist.
- 5 11. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang des Beleuchtungslichtes, vorzugsweise in der Ebene der Objektivpupille, eine farbselektive Segmentblende angeordnet ist.
- 10 12. Rastermikroskop nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die farbselektive Segmentblende im Außen-Randbereich für Licht der Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent ist.
13. Rastermikroskop nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die farbselektive Segmentblende im Innenbereich ausschließlich für Licht oberhalb Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent ist.
- 15 14. Rastermikroskop nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die farbselektive Segmentblende im Innenbereich ausschließlich für Licht unterhalb Wellenlänge des Beleuchtungslichts transparent ist.
15. Rastermikroskop nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht, vorzugsweise gepulstes Infrarotlicht ist.
- 20 16. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht mehrere Wellenlängen aufweist.
17. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Punktdetektor einen Multibanddetektor oder ein Spektrometer beinhaltet.
- 25 18. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Punktdetektor eine Detektionslochblende beinhaltet.
19. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastermikroskop als konfokales Rastermikroskop ausgebildet ist.

Zusammenfassung



5 Ein Rastermikroskop beinhaltet eine Lichtquelle, die eine auf einem Objektträger angeordnete Probe evaneszent beleuchtet. Ein Punktdetektor empfängt von einem Rasterpunkt der Probe ausgehendes Detektionslicht, wobei im Strahlengang des Detektionslichtes eine Strahlablenkeinrichtung angeordnet ist mit der die Position des Rasterpunktes in der Probe verschiebbar ist.

10 Fig. 1

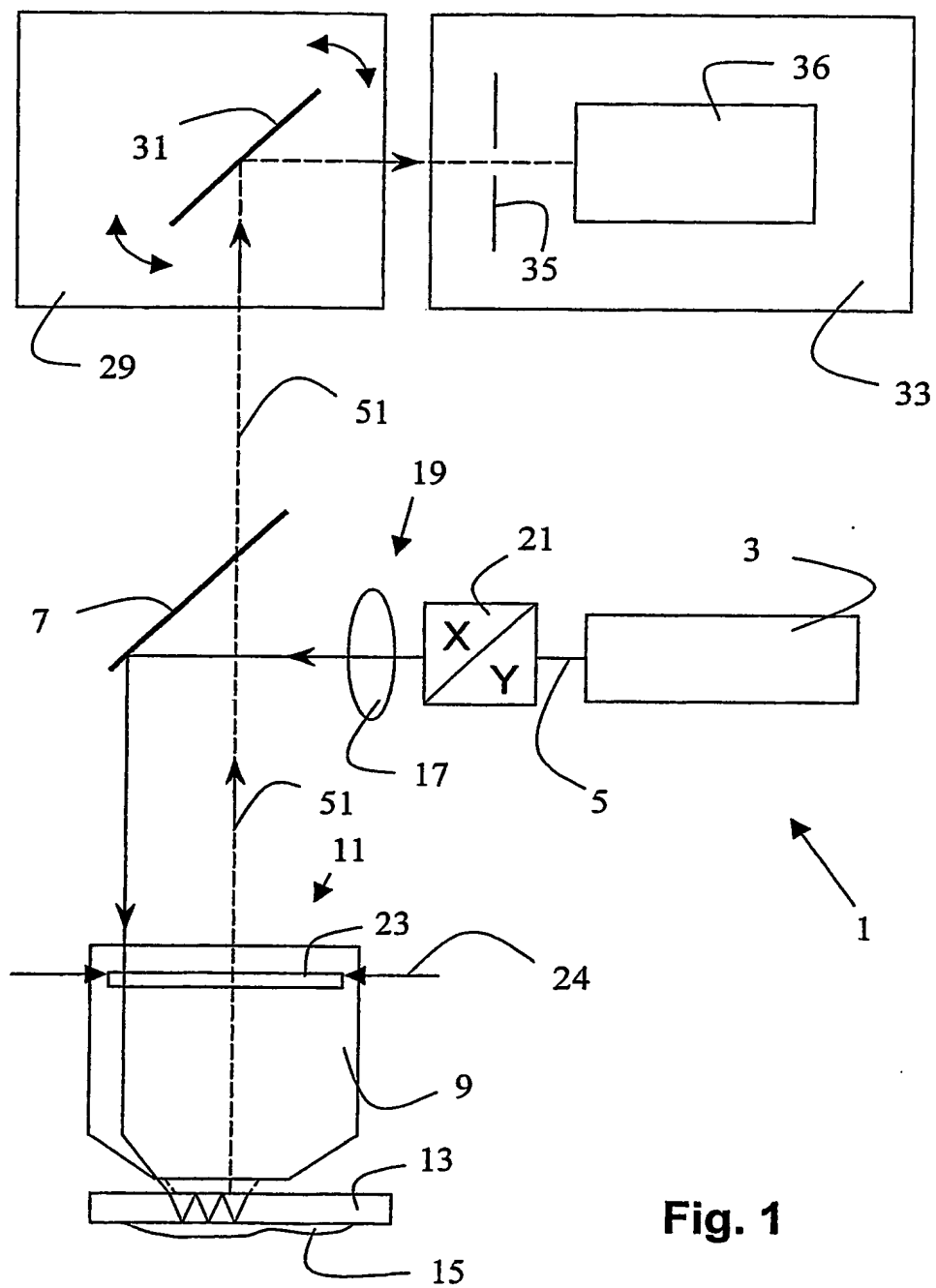


Fig. 1

23

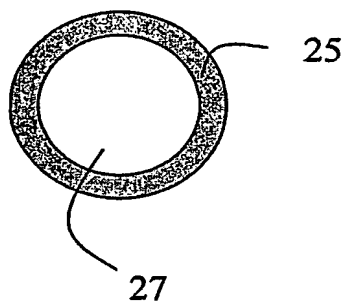
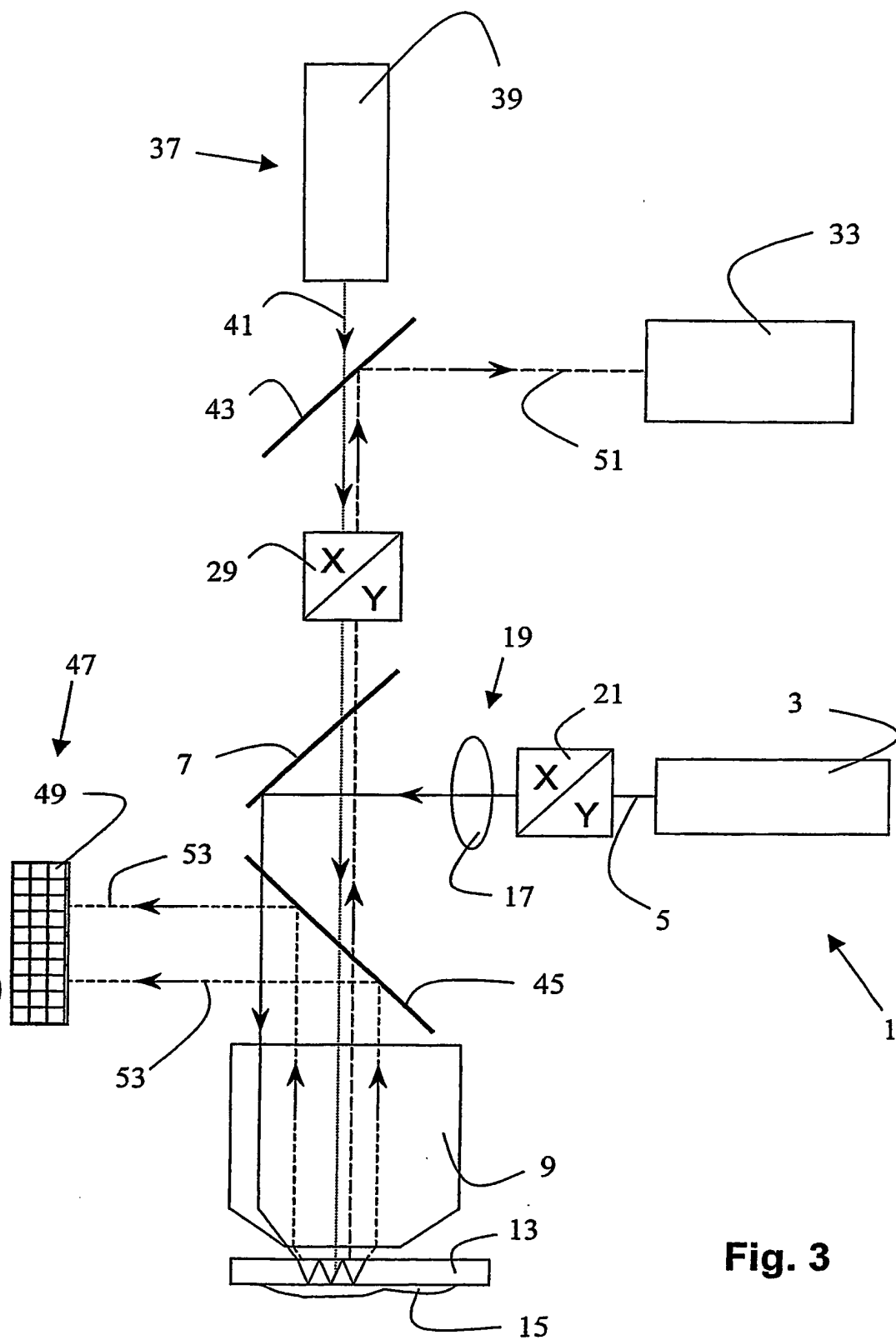


Fig. 2



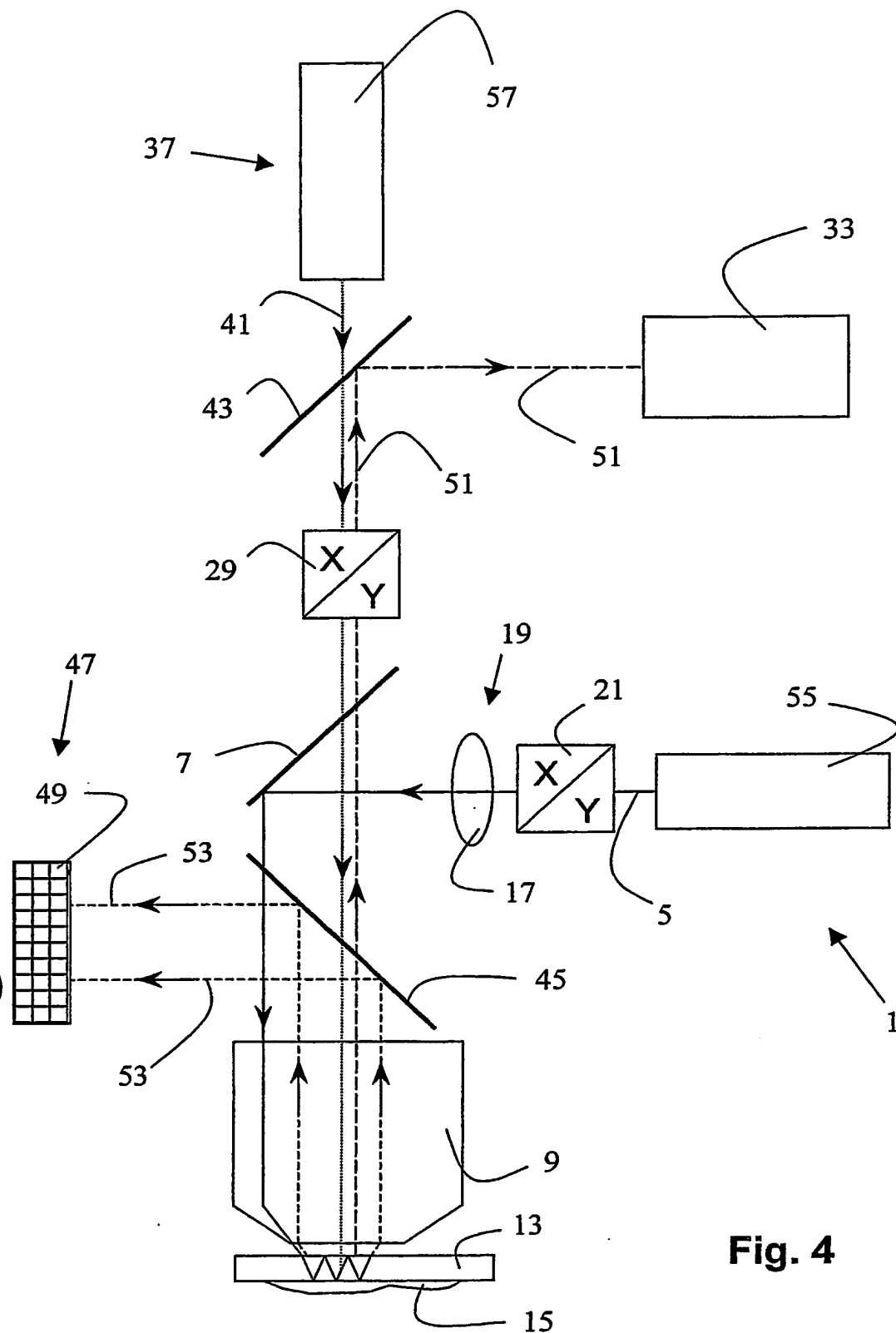


Fig. 4

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.